

ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В СЛОИСТЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ

С.Н.МУСТАФАЕВА, В.А.АЛИЕВ

Институт Физики АН Азербайджана,
Баку-143, пр.Г.Джавида, 33

В слоистых монокристаллах $TlGaSe_2$ изучены температурные зависимости проводимости вдоль и поперек слоев в широкой области температур от 10 до 293 К. Показано, что в области низких температур в монокристаллах $TlGaSe_2$ как вдоль, так и поперек слоев имеет место прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми. Определены плотность состояний $N_F=1,3 \cdot 10^{19} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-3}$, разброс по энергии этих состояний $J=0,011 \text{ эВ}$, расстояния прыжков R с уменьшением температуры от 30 до 10 К увеличивается от 130 до 170 Å.

К настоящему времени многие физические свойства слоистых монокристаллов $TlGaSe_2$ и процессы переноса заряда в них достаточно подробно изучены [1-3]. Однако, как показал проведенный нами анализ опубликованных работ, основное внимание авторы уделяли процессам переноса заряда по разрешенной зоне этих полупроводников, считая, что основной вклад в проводимость вносят носители, переходящие из одной разрешенной зоны в другую или из примесных состояний в одну из разрешенных зон. Достаточно высокая концентрация локализованных состояний в запрещенной зоне (порядка $10^{19} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-3}$) [4,5] приближает эти кристаллы по энергетической структуре к аморфным полупроводникам. Одним из возможных механизмов переноса заряда в аморфных и компенсированных полупроводниках являются термически активированные перескоки. При этом носители заряда перескакивают от одного центра, локализованного в запрещенной зоне, к другому с испусканием или поглощением фона. Обычно прыжковую проводимость наблюдают при низких температурах, когда она доминирует над проводимостью термовозбужденных носителей заряда в разрешенной зоне.

В настоящей работе приведены результаты изучения процессов переноса заряда в слоистых монокристаллах $TlGaSe_2$ в постоянном электрическом поле и при низких температурах. Проводимость образцов определяли как вдоль ($\sigma_{\perp c}$), так и поперек ($\sigma_{\parallel c}$) слоев кристаллов. В качестве контактного материала был использован индий, который вплавлялся в кристаллы и создавал омический контакт с $TlGaSe_2$. Образцы для измерений имели толщину порядка 100-130 мкм. Амплитуда приложенного к кристаллу постоянного электрического поля соответствовала омической области вольт-амперной характеристики.

Проводимость образцов $TlGaSe_2$ была измерена в области температур 10-293 К. Образцы устанавливались в гелиевом криостате марки "УТРЕКС" с системой стабилизации температуры (точность стабилизации 0,02 К).

Измерения проводились в направлении охлаждения кристалла, что исключало влияние термического опустошения локальных уровней.

На рис. 1 приведена температурная зависимость электропроводности монокристаллов $TlGaSe_2$ вдоль слоев ($\sigma_{\perp c}$) в температурном диапазоне 10-232 К. С понижением температуры от 232 до 150 К $\sigma_{\perp c}$ экспоненциально уменьшалась. В этой области температур основной вклад в проводимость вносят носители заряда, активированные с мелкого примесного уровня $E_F=0,04 \text{ эВ}$. С дальнейшим понижением температуры проводимость увеличивалась и при $T=104 \text{ K}$ достигала максимального значения.

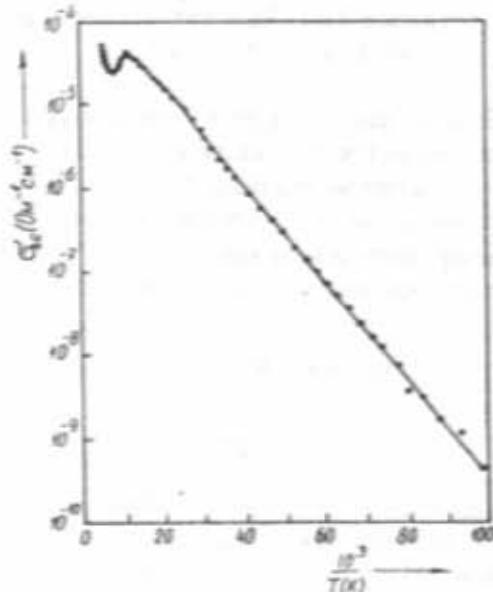


Рис.1. Температурная зависимость проводимости вдоль слоев монокристаллов $TlGaSe_2$.

Аномальный ход $\sigma_{\perp c}$ в этой области температур обусловлен, по-видимому, фазовым переходом, наличие которого установлено также и из измерений теплоемкости и оптических свойств монокристаллов $TlGaSe_2$ в области температур 100-120 К [6]. При $T < 104 \text{ K}$ $\sigma_{\perp c}$ вновь уменьшалась по мере понижения температуры с переменной энергией активации. Эксперименталь-

ные точки в области низких температур (10-30 K) плохо укладывались на одну прямую в координатах $\lg\sigma_{\perp c}$ от $10^3/T$ (рис.1). Примерное значение энергии активации проводимости в этой области температур составляло ~ 0,01 эВ. Однако, эти точки хорошо спрямлялись в координатах $\lg\sigma_{\perp c}$ от $T^{-1/4}$ (рис.2). Указанный экспериментальный факт свидетельствует о том, что в

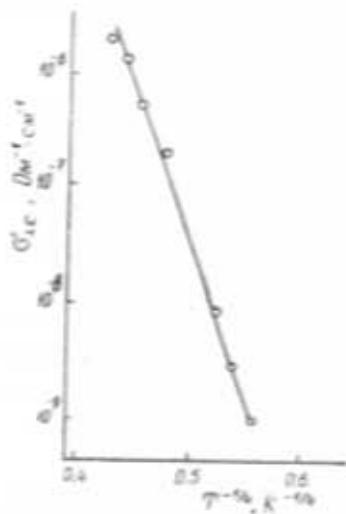


Рис.2. Низкотемпературная проводимость монокристаллов TiGaSe₂ вдоль их слоев в координатах Мотта.

данной области температур в монокристаллах TiGaSe₂ наблюдается прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми. При таком типе проводимости зависимость $\lg\sigma = f(T^{-1/4})$ должна представлять собой прямую с наклоном T_0 [7]:

$$\sigma \sim \exp[-(T_0 / T)^{1/4}] \quad (1)$$

$$T_0 = \frac{16}{N_F \cdot k \cdot a^3} \quad (2)$$

где N_F - плотность состояний вблизи уровня Ферми, k - постоянная Больцмана, a - радиус локализации. Из рис. 2 определено значение $T_0 = 5,4 \cdot 10^5$ K. Зная T_0 , по формуле (2) определили плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми. Для N_F получено значение $1,3 \cdot 10^{19}$ эВ⁻¹см⁻³. При расчете N_F для радиуса локализации взято значение ≈ 30 Å [8] по аналогии с монокристаллом GaSe - бинарным аналогом монокристалла TiGaSe₂. Значение N_F хорошо согласуется по порядку величины с нашими предыдущими результатами по изучению прыжковой проводимости монокристаллов TiGaSe₂ в переменных электрических полях $N_F = 5,4 \cdot 10^{19}$ эВ⁻¹см⁻³.

По формуле:

$$R(T) = \frac{3}{8} \cdot a \cdot T_0^{1/4} T^{-1/4} \quad (3)$$

определен расстояние прыжков R носителей заряда при различных температурах. С уменьшением температуры от 30 до 10 K значение R увеличивалось от 130 до 170 Å. Как видно, среднее расстояние прыжка R в 5 раз превышает среднее расстояние между центрами локализации носителей заряда.

Из условия [7]:

$$\frac{4}{3} \pi R^3 N_F \cdot \frac{J}{2} = 1 \quad (4)$$

определен разброс ловушечных состояний вблизи уровня Ферми:

$$J = 0,011 \text{ эВ.}$$

Вышеизложенное относилось к случаю проводимости монокристаллов TiGaSe₂ вдоль слоев ($\sigma_{\perp c}$). Несколько иной характер имела температурная зависимость проводимости TiGaSe₂ вдоль оси С кристалла ($\sigma_{\parallel c}$). Проводимость образцов, изготовленных в сэндвич-варианте, была измерена в интервале температур 96-293 K (рис.3). К сожалению, при более низких температурах измерения не производились из-за малости величины токов в образцах.

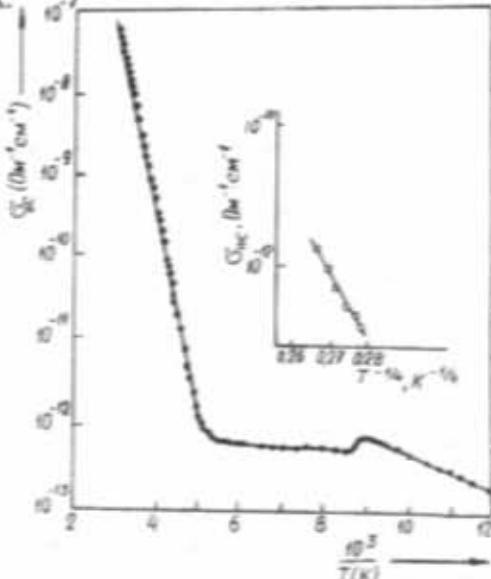


Рис.3. Зависимость $\sigma_{\parallel c}$ в монокристаллах TiGaSe₂ от температуры в координатах $\lg\sigma_{\parallel c}$ от $10^3/T$ и $\lg\sigma_{\parallel c}$ от $T^{-1/4}$.

Высототемпературная ветвь зависимости $\sigma_{\parallel c}(T)$ носила экспоненциальный характер. Наклон этой зависимости в интервале температур 210-293 K составлял 0,54 эВ. Ниже 210 K энергия активации проводимости непрерывно уменьшалась и при $T \leq 165$ K почти не зависела от температуры. Однако, при $T = 113$ K на зависимости $\sigma_{\parallel c}(T)$ наблюдался небольшой "всплеск" проводимости. Как было отмечено выше, в монокристаллах TiGaSe₂ в области температур

100-120 K имеет место фазовый переход. О непрерывном уменьшении энергии активации проводимости до нуля в монокристаллах TiGaSe₂ при низких температурах сообщалась и в работе [3], однако причина такого поведения σ_{||} в [3] не установлена. Монотонно уменьшающуюся с понижением температуры проводимость σ_{||} TiGaSe₂ мы связываем с прыжками носителей заряда по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми. Перестроенная в координатах $\lg \sigma_{||}$ от $T^{-1/4}$ зависимость проводимости представлена на вставке рис.3. Наклон этой зависимости составлял $T_0 = 3,4 \cdot 10^6$ К. Для плотности локализованных состояний вблизи уровня Ферми получено значение $N_F = 2 \cdot 10^{18}$ эВ⁻¹см⁻³. Расстояния прыжков носителей заряда поперек слоев монокристаллов TiGaSe₂, определенные по формуле (3), составляли: 129 Å при 200 K и 136 Å при 165 K.

Наблюдаемая в TiGaSe₂ температурно-независимая проводимость, по-видимому, есть не что иное, как безактивационная прыжковая проводимость, когда прыжки носителей заряда происходят с испусканием фононов.

Полученные нами экспериментальные результаты показали, что при низких температурах как вдоль, так и поперек слоев монокристаллов TiGaSe₂ имеет место прыжковый механизм переноса заряда по локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. Однако, следует отметить, что прыжковая проводимость вдоль слоев монокристаллов TiGaSe₂ становится преобладающей над проводимостью по разрешенной зоне только при очень низких температурах (10-30 K), в то время как поперек слоев TiGaSe₂ прыжковая проводимость наблюдается при довольно высоких температурах ($T \leq 210$ K) и охватывает более широкий температурный диапазон.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Isaaks T.J., J.D. Feichter J. Solid State Chem., 1975, v.14, № 3, p.260-263.
- [2] D. Müller, H. Hahn. Zs. Anorg. allg. Chem., 1978, v.438, p.258-272.
- [3] И.А. Карпович, А.А. Червова, Л.И. Демидова Изв. АН СССР, неорганические материалы, 1972, т.8, № 1, с.70-72.
- [4] А.М. Дарвиш, А.Э. Бахышев, В.И. Тагиров ФТП, 1977, т.11, № 4, с.780-781.
- [5] С.Н. Мустафаева, С.Д. Мамедбейли, И.А. Мамедбейли, Неорганические материалы, 1994, т.30, № 5, с.626-628.
- [6] С.Г. Абдулаева, А.М. Абдулаев, К.К. Мамедов, Н.Т. Мамедов, ФТП, 1984, т.26, № 2, с.618-620.
- [7] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах, М.: Мир, 1974-472 с.
- [8] С.Н. Мустафаева, Неорганические материалы, 1994, т.30, № 5, с. 619-621.

S.N.MUSTAFAYEVA, V.Ə.ƏLİYEV

TiGaSe₂ MONOKRİSTALLARINDA YÜKDAŞIMA PROSESİ

TiGaSe₂ laylı monokristallarında geniş temperatur aralığında (10-293 K) elektrikkeçirmənin anizotropiyası və temperatur asılılığı tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, TiGaSe₂ monokristallarında Fermi səviyyəsinin yaxınlığında lokallaşmış səviyyələr boyunca keçiricilik baş verir. Fermi səviyyəsi yaxınlığında enerji hallarının sıxlığı təyin olunmuşdur: $N_F = 1,3 \cdot 10^{19}$ ev⁻¹cm⁻³. Sıçrayışların uzunluğu dəyişkən olub, 30 K temperaturda olan 130 Å -dən 10 K temperaturda 170 Å qədər artır.

S.N.MUSTAFAEVA, V.A.ALIEV

CHARGE TRANSPORT IN LAYER TiGaSe₂ SINGLE CRYSTALS.

The present report gives experimental results on the behaviour of the electric conductivities along ($\sigma_{||c}$) and across ($\sigma_{\perp c}$) the layers in TiGaSe₂ single crystals at 10-293 K. It was shown that at temperatures $T=10-30$ K hopping conductivity at Fermi level takes place along the layers in TiGaSe₂ single crystals. The conductivity of specimens on the base of TiGaSe₂ in sandwich-structure ($\sigma_{\perp c}$) shows hopping character at the temperatures $T \leq 210$ K. Density of localized states near the Fermi level $N_F = 1,3 \cdot 10^{19}$ ev⁻¹cm⁻³ and hopping distances R at various temperatures were calculated, for example, hopping distance along the layers in TiGaSe₂ single crystals was equal to 130 Å at 30 K and 170 Å at 10 K.

Редактор: Ф.М. Гашимзаде.
Поступило 20.12.96